

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

5269729

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 60202931 A2 851014 <No. of Patents: 002>

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE (English)

Patent Assignee: HITACHI LTD

Author (Inventor): SAITO TADASHI; ITOU HARUO; SHINTANI AKIRA; SAITOU AKIO;

NAKATANI MITSUO

IPC: \*H01L-021/268; H01L-021/324

CA Abstract No: \*104(16)140470U;

Derwent WPI Acc No: \*C 85-293687;

JAPJO Reference No: \*100050E000028;

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date
JP 60202931	A2	851014	JP 8458246	A	840328 (BASIC)
JP 94056839	B4	940727	JP 8458246	A	840328

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 8458246 A 840328

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01724431 \*\*Image available\*\*

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

PUB. NO.: 60-202931 [JP 60202931 A]

PUBLISHED: October 14, 1985 (19851014)

INVENTOR(s): SAITO TADASHI

ITO HARUO

SHINTANI AKIRA

SAITO AKIO

NAKATANI MITSUO

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP  
(Japan)

APPL. NO.: 59-058246 [JP 8458246]

FILED: March 28, 1984 (19840328)

INTL CLASS: [4] H01L-021/268; H01L-021/324

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD: R002 (LASERS); R096 (ELECTRONIC MATERIALS -- Glass Conductors); R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors, MOS)

JOURNAL: Section: E, Section No. 384, Vol. 10, No. 50, Pg. 28,  
February 27, 1986 (19860227)

**ABSTRACT**

PURPOSE: To form a conduction type layer having low resistance while annealing only a layer extremely near to a surface layer by thermally treating a semiconductor film containing amorphous silicon phase in a short time by using an ultraviolet laser having a short wavelength.

CONSTITUTION: A gate electrode 11 is formed on a glass substrate 1, and an SiO<sub>2</sub> film 12 and an n type amorphous silicon film 13 are shaped through a plasma CVD method. Source and drain electrodes 14 and 15 are evaporated, and a laser 7 is projected from the lower section of the substrate 1. An ultraviolet laser, a wavelength thereof extends over 300nm or less and intensity of irradiation thereof extends over 0.2J/cm<sup>2</sup> or less, is employed as laser beams 7. The amorphous silicon films of the lower section of the source and drain electrodes 14, 15 are property-changed into an silicon film 16 containing a crystalline substance.

## ②公開特許公報(A) 昭60-202931

③Int.Cl.

H 01 L 21/268  
21/324

識別記号

府内整理番号

6603-5F  
6603-5F

④公開 昭和60年(1985)10月14日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

## ⑤発明の名称 半導体装置の製造方法

⑥特 願 昭59-58246

⑦出 願 昭59(1984)3月28日

⑧発明者 齊藤 忠 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑨発明者 伊藤 晴夫 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑩発明者 新谷 昭 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑪発明者 齊藤 昭男 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内

⑫出願人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑬代理人 弁理士 高橋 明夫 外1名

最終頁に続く

## 明細書

発明の名称 半導体装置の製造方法

## 特許請求の範囲

1. 脱離された基板上に形成した非晶質シリコン膜を主体として構成したシリコン系薄膜半導体装置の製造方法において、n形もしくはp形不純物を含有する非晶質相シリコンを含有する半導体膜をレーザアーナーにより低抵抗化することを特徴とする半導体装置の製造方法。
2. 特許請求の範囲第1項において、上記レーザとして波長300nm以下の紫外レーザを用いることを特徴とする半導体装置の製造方法。
3. 特許請求の範囲第1項ないし第2項において、レーザとして波長300nm以下で照度0.2J/cm<sup>2</sup>以下の紫外レーザを用い、シリコン膜の表面近傍をアーナーすることを特徴とする半導体装置の製造方法。

## 発明の詳細な説明

## 〔発明の利用分野〕

本発明は、半導体装置の製造方法に関する、詳し

くは低抵抗のアモルファス相を含有するn又はp形半導体部を有する薄膜半導体装置の製造方法に関する。

## 〔発明の背景〕

従来のアモルファスSi相を含有する半導体薄膜は、ガラス、金属又は高分子薄膜上にプラズマCVD法などの方法で形成され、導電型の制御はPH<sub>3</sub>やA<sub>2</sub>H<sub>2</sub>ガスを流してのn形ドーピングもしくはB<sub>2</sub>H<sub>6</sub>ガスを流してのp形ドーピングによって行われていた。かかるドープドSi膜の抵抗率はp形で約10<sup>10</sup>Ω·cm、n形で10<sup>9</sup>Ω·cmと高く、高い直列抵抗のため電子性能が劣っていた。又、n形ドーピングの場合、プラズマパワーを増加するなどの方法でアモルファス相を微結晶化することも可能であるが、得られた抵抗率は約1Ω·cmとあまり低くはない。

## 〔発明の目的〕

本発明の目的は、かかる従来の問題点を解決し、低抵抗の導電型層を形成できる半導体装置の製造方法を提供することにある。

## 〔発明の概要〕

従来、半導体膜の低抵抗化を実現する方法として熱処理法がある。しかし、アモルファス膜の場合、通常の電気炉を用いる長時間熱処理法では、活性層であるノグドープ層が変質し、デバイスが劣化してしまう。この点を解決するため、本発明では、熱処理時間が1秒以下のレーザーを用いた短時間熱処理法を用いる。レーザーとして、バルスレーザーとCWレーザーがあり、CWの場合走査速度を早くすれば実質的に短時間の熱処理が可能である。かかるレーザーとして次のものがある。バルスレーザーとして、エキシマレーザー(波長: 51~351 nm)、ルビーレーザー(694 nm)、ネオジウムYAG(266, 532, 1064 nm)、ガラスレーザー(531 nm)やプレキサンドライトーラー(700~818 nm)などがある。CWレーザーとして、Arイオンレーザー(257 nm)やHeNeレーザー(633 nm)などがある。今迄、アモルファスSiのレーザーアニールとして、QスイッチのNd:YAGレーザー(1064 nm)が用

いられた例は知られているが、アモルファスSi膜の吸収係数からして適切な波長では無く、從って良好なデバイス特性は得られていない。

アモルファスSi半導体装置で用いられる半導体膜の厚さは通常1μm以下であるので吸収係数として $10^4 \text{ cm}^{-1}$ 以上の値を持つレーザー波長を選択する必要がある。このためには、アモルファスSi膜の場合、750 nmより短かい波長のレーザー光を用いる必要がある。特に、上記各種レーザー光の中で、波長300 nm以下のレーザー光を用いれば吸収係数は $10^4 \text{ cm}^{-1}$ となり光の吸収深さは約10 nmで膜方向の上部半導体層のみ熱処理できるなどの利点を有する。これに適したレーザーとして、エキシマレーザー、アルゴンイオンレーザーとNd:YAGレーザー(波長=質量で266 nm)がある。特に、エキシマレーザーは励起ガスの種類を変えて、発振波長を変えることが可能である。例えば、F<sub>2</sub>(157 nm)、ArF(193 nm)、KrCl(222 nm)、KrP(248 nm)、XeBr(282 nm)、XeCl(308 nm)とXeF(351

nm)で出力も数十W迄の大出力で大口径のレーザーが得られている。

本発明は、かかる短波長のレーザーを用い、アモルファスSi相を含有する半導体膜の熱処理を行う。半導体膜として、n又はpなどのp型不純物、P又はBなどのn型不純物を含有するアモルファスSi:H膜、微結晶化Si:H膜、SiGe:H膜、SiN:H膜やSiC:H膜などがある。不純物を該Si膜中に含有させる工程として、プラズマCVDなどの膜形成中にガスから導入する方法とノンドープ又は低濃度ドープ層中にイオン打込み法で導入する方法の2種類がある。

## 〔発明の実施例〕

以下、本発明の実施例を説明する。

## 実施例1

グロー放電を用いるプラズマCVD法により、SiH<sub>4</sub>-B<sub>2</sub>H<sub>6</sub>(又は、PH<sub>3</sub>)系ガスを用い、B又はPドープのアモルファスSi膜を形成した。その膜の抵抗率を第1表に示す。

第1表

試料No.	導電型	抵抗率(Ω·cm)
99-2	p	$2.39 \times 10^4$
110-2	p	$3.32 \times 10^4$
58-2	n	$1.20 \times 10^3$
120-1	n	2.50

レーザーとして、KrF系エキシマレーザー(波長248 nm、バルス幅15 ns)を用い、該アモルファスSi膜を照射した。第1図は、レーザー照射強度を変えて照射した後の抵抗率変化を示す。レーザーパワー密度 $0.2 \text{ J/cm}^2$ 迄はスーパーニアに抵抗率が減少し、その後直線的に減少している。得られた抵抗率は第1表の値に比べて極めて小さく、通常の多結晶膜と同程度の値となっている。特に、レーザーパワー密度 $0.2 \text{ J/cm}^2$ 以上でのアーナー膜はX線回折によると結晶化していることが明らかになった。レーザーパワー密度

$0.2 \text{ J/cm}^2$  以下でアニールした膜は、微結晶相を含む非晶質膜で、膜表面の形状は平滑であり、デバイス作製用として適している。

#### 実施例 2

CW(連続発振)のアルゴンイオンレーザーを用い、実施例 1 と同様な非晶質膜にレーザアニールを行った。

波長は ADF 光学結晶を用い第 2 高調波である  $257 \text{ nm}$  とし、走査速度  $1 \text{ mm/s}$  で該ドープ非晶質シリコン膜をアニールした。照射後の抵抗変化は第 1 図と同様であった。この方法では、ビーム走査により、均質に熱処理を行える特長がある。

#### 実施例 3

グロー放電を用いるプラズマ CVD 法により、第 2 図に示したように、ガラス基板 1 上に、n 形層 2、i 形層 3 および p 形層 4 を形成した。その後、波長  $193 \text{ nm}$  の ArF エキシマーレーザ 7 を照射した結果、照射前の抵抗率  $2.4 \times 10^6 \Omega \cdot \text{cm}$  が照射後  $3.1 \times 10^6 \Omega \cdot \text{cm}$  と抵抗率が低下した。

これにより、p-i-n 型ダイオードの直列抵抗が低下し、整流比が改善された。

#### 実施例 4

実施例 3において p 形層 4 として、炭素入りの非晶質シリコンカーバイド膜を用いた。レーザ照射の抵抗率  $3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{cm}$  が照射後  $3.0 \times 10^6 \Omega \cdot \text{cm}$  と抵抗率を低減することができた。

#### 実施例 5

シリコン薄膜を用いた MOSFET の製造方法を第 3 図に示す。

ガラス基板 1 上にゲート電極 (Mo, Cr など) 11 を形成後、プラズマ CVD 法により  $\text{SiO}_2$  膜 12 および n 形非晶質シリコン膜 13 を形成した。ソースおよびドレイン電極 14 および 15 を蒸着し、ガラス基板 1 の下部からレーザ 7 の照射を行った。レーザ照射条件は実施例 1 ～ 3 と同様で良い。このレーザ照射により、ゲート電極 11 上の非晶質シリコン膜は変化しないがソースおよびドレイン電極 14 と 15 の下部の非晶質シリコン膜は結晶質を含むシリコン膜 16 に変質した。

#### 実施例 6

シリコン薄膜 MOSFET の他の製造方法を第 4 図に示す。

ガラス基板 1 上にソースおよびドレイン電極 21 および 22 を形成後、プラズマ CVD 法により  $\text{SiO}_2$  23 および n 形非晶質シリコン膜 24 を連続形成した。ゲート電極 25 を形成後、該ゲート電極をマスクとして p+ イオン 8 の打込みを行い、実施例 1 ～ 3 と同様なレーザアニールを行った。このレーザアニールにより、低抵抗シリコン膜 26 を形成した。この方法で、MOSFET のセルフアラインによる形成が可能となり、得られた FET の ON/OFF 比も向上した。

#### (発明の効果)

本発明によれば下記のことが実現できる。

- (1) 簡めて低抵抗の n 形および p 形層を作製できる。
- (2) セルアラインが可能である。
- (3) 極く表面層のみアニールできる。
- (4) 乾燥プロセスである。

従って、本発明により、安価な大面積基板上に、劣れた性能を有する半導体薄膜装置を作製することができる。

#### 図面の簡単な説明

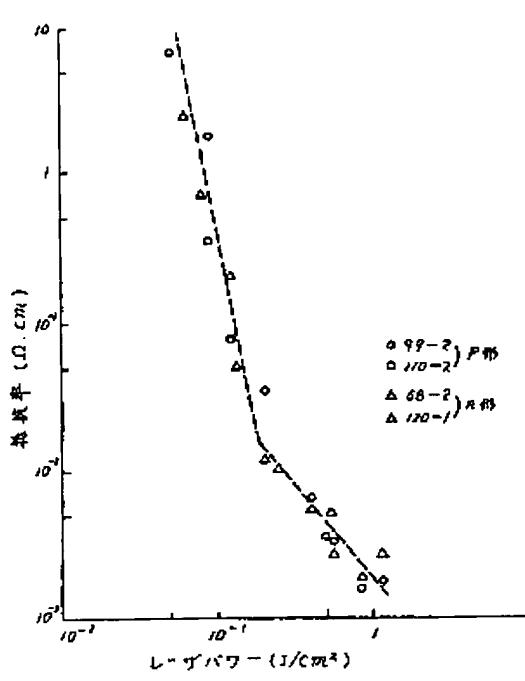
第 1 図は本発明の効果を説明するための图、第 2 図乃至第 4 図は、それぞれ本発明の異なる実施例を示す工程図である。

1 … ガラス基板、2 … n 形層、3 … i 形層、4 … p 形層、7 … レーザ光、8 … イオン、11 … ゲート電極、12 …  $\text{SiO}_2$  膜、13 … n 形非晶質シリコン膜。

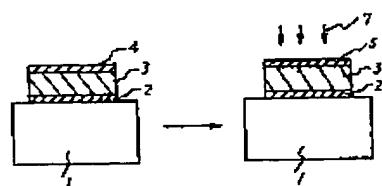
代理人 博士 高橋 明



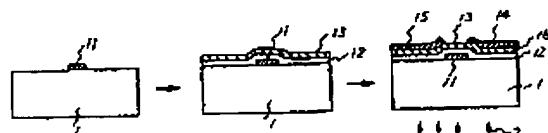
第1図



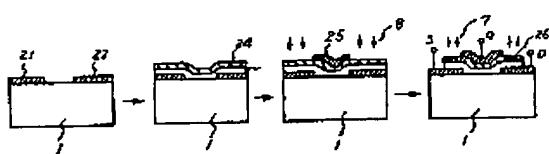
第2図



第3図



第4図



第1頁の続き

◎発明者 中谷 光雄 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内